

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารทางวิชาการ	2
2.1 ความเป็นมาของสารเซอร์โคเนียมดีตาเนต	3
2.2 โครงสร้างของเซอร์โคเนียมดีตาเนต	8
2.3 ลักษณะเฉพาะของไดอิเล็กตริกเรโซเนเตอร์	13
2.4 ตัวอย่างการนำเซรามิกไดอิเล็กตริกเรโซเนเตอร์ประยุกต์ใช้งาน	20
บทที่ 3 วิธีการทดลอง	22
3.1 สารเคมีที่ใช้	22
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้	23
3.3 การเตรียมผงเซอร์โคเนียมดีตาเนต	24
3.4 การตรวจสอบผงที่เตรียมได้	27
3.4.1 วิธีดีฟเฟอร์เรนเชียล เทอร์มอล อนาไลซิส (DTA)	27
3.4.2 วิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)	28
3.4.3 วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)	30
3.5 การเตรียมเซรามิกเซอร์โคเนียมดีตาเนต	32
3.6 การตรวจสอบเซรามิกที่เตรียมได้	34
3.6.1 การหาค่าการหดตัว	34
3.6.2 การหาค่าความหนาแน่น	35
3.6.3 การหาค่าความพรุน	36
3.6.4 การวัดค่าสภาพยอมสัมพัทธ์และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก	36
3.6.5 การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของเซรามิก	39

บทที่ 4 ผลการทดลองและการอภิปรายผล	41
4.1 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของสารผสมด้วยเทคนิค DTA	41
4.2 ผลการตรวจสอบสารผสมที่ผ่านการเผาแคลไซน์ด้วยเทคนิค XRD	46
4.3 ผลการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของผงเซอร์โคเนียมดีตาเนต	57
4.4 ผลการตรวจสอบลักษณะและสมบัติทางกายภาพของเซรามิกเซอร์โคเนียมดีตาเนตที่เตรียมได้	59
4.5 ผลการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเซอร์โคเนียมดีตาเนต	67
4.6 ผลการตรวจสอบพฤติกรรมทางไฟฟ้าของเซรามิกเซอร์โคเนียมดีตาเนต	74
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล	81
5.1 สรุป	81
5.2 ข้อเสนอแนะ	82
เอกสารอ้างอิง	83
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก การคำนวณค่าความหนาแน่นทางทฤษฎีของเซอร์โคเนียมดีตาเนต	89
ภาคผนวก ข ข้อมูลความหนาแน่นของน้ำที่ขึ้นกับอุณหภูมิ	90
ภาคผนวก ค ข้อมูลค่าสภาพยอมสัมพัทธ์และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความถี่และอุณหภูมิของเซรามิกที่เตรียมได้	91
ประวัติผู้เขียน	103

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงวัสดุในกลุ่มไดอิเล็กตริกเรโซเนเตอร์ที่ใช้ในทางการค้า	2
2.2 แสดงค่าสภาพยอมสัมพัทธ์และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกเซอริโคเนียมติดตามเนตที่ยานความถี่ต่างๆ	19
3.1 แสดงปริมาณสารตั้งต้นที่ได้จากการคำนวณ	24
4.1 แสดงรายละเอียดของเงื่อนไขการเผาแคลไซน์สารที่ใช้ โดยมีอัตราการใช้-ลง อุณหภูมิที่ 5 °ซ / นาที	46
4.2 แสดงผลการคำนวณปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของเฟส ZT ที่เกิด ณ เงื่อนไขการแคลไซน์ต่าง ๆ ของสารผสมเมื่อใช้อัตราส่วนเซอริโคเนียมต่อติดตามเนียม เป็น 0.2 : 1.8 โดยโมล	52
4.3 แสดงผลการคำนวณปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของเฟส ZT ที่เกิด ณ เงื่อนไขการแคลไซน์ต่าง ๆ ของสารผสมเมื่อใช้อัตราส่วนเซอริโคเนียมต่อติดตามเนียม เป็น 0.4 : 1.6 โดยโมล	52
4.4 แสดงผลการคำนวณปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของเฟส ZT ที่เกิด ณ เงื่อนไขการแคลไซน์ต่าง ๆ ของสารผสมเมื่อใช้อัตราส่วนเซอริโคเนียมต่อติดตามเนียม เป็น 0.6 : 1.4 โดยโมล	53
4.5 แสดงผลการคำนวณปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของเฟส ZT ที่เกิด ณ เงื่อนไขการแคลไซน์ต่าง ๆ ของสารผสมเมื่อใช้อัตราส่วนเซอริโคเนียมต่อติดตามเนียม เป็น 0.8 : 1.2 โดยโมล	53
4.6 แสดงผลการคำนวณปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของเฟส ZT ที่เกิด ณ เงื่อนไขการแคลไซน์ต่าง ๆ ของสารผสมเมื่อใช้อัตราส่วนเซอริโคเนียมต่อติดตามเนียม เป็น 1.0 : 1.0 โดยโมล	54
4.7 แสดงอิทธิพลของเงื่อนไขการเผาซินเตอร์ที่ใช้ในการเตรียมของเซรามิก ZT ต่อค่าความหดรัดตัว (S) ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ρ) และค่าความพรุนสัมพัทธ์ (P)	60

สารบัญภาพ

รูป		หน้า
2.1	แสดงภาพถ่ายโครงสร้างของ $ZrTiO_4$ ในทิศทาง [010] ที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมแบบ (ก) ไม่สม่ำเสมอและ (ข) สม่ำเสมอแต่ไม่ได้สัดส่วน	8
2.2	แสดงเฟสไดอะแกรมระหว่างเซอร์โคเนียมไดออกไซด์กับิตาเนียมไดออกไซด์	10
2.3	แสดงลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคจากภาพถ่าย SEM ของเซอร์โคเนียมิตาเนต (ก) ผงที่ผ่านการเผาแคลไซน์ด้วยอุณหภูมิ 1200 °ซ และ(ข) เซรามิกที่ผ่านการเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิ 1600 °ซ	11
2.4	แสดงภาพถ่าย SEM ของเซรามิกเซอร์โคเนียมิตาเนตเมื่อใช้อัตราการลดลงของอุณหภูมิเป็น (ก) 120 °ซ / ชั่วโมง และ(ข) 1 °ซ / ชั่วโมง	12
2.5	แสดงภาพถ่าย TEM ของอนุภาคเซอร์โคเนียมที่ปนอยู่กับเซรามิกเซอร์โคเนียมิตาเนต สเกลที่ใช้มีขนาดเท่ากับ 0.5 ไมโครเมตร	13
2.6	แสดงการเกิดโพลาไรเซชันแบบต่างๆ	15
2.7	แสดง (ก) ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์และ (ข) ค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกของสารไดอิเล็กตริกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความถี่	16
2.8	แสดงลักษณะของไดอิเล็กตริกเรโซเนเตอร์	20
2.9	แสดงวงจร oscillation แบบ (ก) Colpitts circuit และ (ข) Hertyly circuit	21
3.1	แผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมผงเซอร์โคเนียมิตาเนตที่ใช้	26
3.2	แผนภาพแสดงแผนผังการเผาแคลไซน์ที่ใช้	26
3.3	แสดงหลักการทำงานของเครื่อง DTA	27
3.4	แสดงการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากระนาบของอะตอม	29
3.5	แสดงการเกิดอันตรกิริยาของลำอิเล็กตรอนกับสารตัวอย่าง	31
3.6	กราฟแสดงการกระจายพลังงานของอิเล็กตรอนที่เปล่งออกจากสารตัวอย่าง	31
3.7	แผนภาพแสดงการเตรียมสารตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ SEM	32
3.8	แผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเซรามิกเซอร์โคเนียมิตาเนตที่ใช้	33
3.9	แสดงการจัดเรียงชิ้นงานในถ้วยอลูมินาเพื่อเผาซินเตอร์	33
3.10	แสดงแผนผังการเผาซินเตอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้	34

3.11	แสดงลักษณะการจัดเครื่องมือสำหรับการทดลองเพื่อทำการตรวจสอบพฤติกรรมทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกที่เตรียมได้	37
3.12	แสดงส่วนประกอบของชุดบรรจุชิ้นงาน สำหรับการวัดค่าความจุและ ค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกของเซรามิก ZT ที่เตรียมได้	38
4.1	แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของสารผสมระหว่าง ZrO_2 กับ TiO_2 เมื่อ * และ ∇ แทนเฟสของ ZrO_2 กับ TiO_2 ตามลำดับ	40
4.2	แสดงกราฟ DTA ของสารผสมที่มีอัตราส่วนของ Zr:Ti เป็น 1:1 โดยโมล ด้วยการใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ $10^{\circ}C / นาที$	42
4.3	สารผสมที่ผ่านการเผาแคลไซน์ด้วยอุณหภูมิ (ก) $1250^{\circ}C$ และ (ข) $1300^{\circ}C$ เมื่อ * , • และ ∇ แทนเฟสของ $ZrTiO_4$, ZrO_2 และ TiO_2 ตามลำดับ	44
4.4	แบบจำลองรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่สร้างจากการใช้ข้อมูลของ TiO_2 และ $ZrTiO_4$ ใน JCPDS หมายเลข (ก) 21-1276 และ (ข) 34-415 ตามลำดับ	45
4.5	แสดง XRD patterns ของสารผสมระหว่าง ZrO_2 กับ TiO_2 แบบ 0.2 : 1.8 โดยโมล ที่เงื่อนไขการเผาแคลไซน์แตกต่างกัน เมื่อ * , • และ ∇ แทนเฟสของ $ZrTiO_4$, ZrO_2 และ TiO_2 ตามลำดับ	47
4.6	แสดง XRD patterns ของสารผสมระหว่าง ZrO_2 กับ TiO_2 แบบ 0.4 : 1.6 โดยโมล ที่เงื่อนไขการเผาแคลไซน์แตกต่างกัน เมื่อ * , • และ ∇ แทนเฟสของ $ZrTiO_4$, ZrO_2 และ TiO_2 ตามลำดับ	48
4.7	แสดง XRD patterns ของสารผสมระหว่าง ZrO_2 กับ TiO_2 แบบ 0.6 : 1.4 โดยโมล ที่เงื่อนไขการเผาแคลไซน์แตกต่างกัน เมื่อ * , • และ ∇ แทนเฟสของ $ZrTiO_4$, ZrO_2 และ TiO_2 ตามลำดับ	49
4.8	แสดง XRD patterns ของสารผสมระหว่าง ZrO_2 กับ TiO_2 แบบ 0.8 : 1.2 โดยโมล ที่เงื่อนไขการเผาแคลไซน์แตกต่างกัน เมื่อ * , • และ ∇ แทนเฟสของ $ZrTiO_4$, ZrO_2 และ TiO_2 ตามลำดับ	50
4.9	แสดง XRD patterns ของสารผสมระหว่าง ZrO_2 กับ TiO_2 แบบ 1.0 : 1.0 โดยโมล ที่เงื่อนไขการเผาแคลไซน์แตกต่างกัน เมื่อ * , • และ ∇ แทนเฟสของ $ZrTiO_4$, ZrO_2 และ TiO_2 ตาม	51
4.10	แสดงภาพถ่าย SEM ของผงเซอร์โคเนียมดีทานเนตเมื่อเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) $1300^{\circ}C$ (ข) $1350^{\circ}C$ และ (ค) $1400^{\circ}C$	58

4.11	แสดง XRD patterns ของเซรามิก ZT ที่ผ่านการเผาซินเตอร์ด้วยเงื่อนไขต่างๆ	62
4.12	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการหดตัวเชิงเส้นกับอุณหภูมิซินเตอร์ของเซรามิก ZT เมื่อใช้ระยะเวลาเผาแช่ นานต่างกัน	63
4.13	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิซินเตอร์ของเซรามิก ZT เมื่อใช้ระยะเวลาเผาแช่ นานต่างกัน	64
4.14	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความพรุนสัมพัทธ์กับอุณหภูมิซินเตอร์ของเซรามิก ZT เมื่อใช้ระยะเวลาเผาแช่ นานต่างกัน	65
4.15	แสดงภาพถ่าย SEM พื้นผิวหน้าของเซรามิก ZT ที่ผ่านการเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิ (ก) 1450 °ซ (ข) 1500 °ซ (ค) 1550 °ซ และ (ง) 1600 °ซ	68
4.16	แสดงภาพถ่าย SEM ของบริเวณผิวหน้าเซรามิก ZT ที่ผ่านการเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิ (ก)1450 (ข) 1500 (ค) 1550 และ (ง) 1600 °ซ นาน 8 ชั่วโมง	70
4.17	แสดงภาพถ่าย SEM บริเวณผิวหน้าที่ทำการขัดของเซรามิกที่ใช้อุณหภูมิซินเตอร์ (ก)1450 (ข) 1500 (ค) 1550 และ (ง) 1600 °ซ นาน 4 ชั่วโมง	71
4.18	แสดงภาพถ่าย SEM บริเวณผิวที่ไม่ได้ทำการขัดของเซรามิกที่ใช้อุณหภูมิซินเตอร์ (ก)1450 (ข) 1500 (ค) 1550 และ (ง) 1600 °ซ นาน 4 ชั่วโมง	72
4.19	แสดงภาพถ่าย SEM บริเวณผิวที่ไม่ได้ทำการขัดของเซรามิกที่ใช้อุณหภูมิซินเตอร์ (ก)1450 (ข) 1500 (ค) 1550 และ (ง) 1600 °ซ นาน 6 ชั่วโมง	73
4.20	แสดงภาพถ่าย SEM บริเวณผิวที่ไม่ได้ทำการขัดของเซรามิกที่ใช้อุณหภูมิซินเตอร์ (ก)1450 (ข) 1500 (ค) 1550 และ (ง) 1600 °ซ นาน 8 ชั่วโมง	74
4.21	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (ϵ_r) และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ($\tan \delta$) เทียบกับ (ก) ความถี่ และ (ข) อุณหภูมิของเซรามิก ZT ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 95	75
4.22	แสดงพฤติกรรมของค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (ϵ_r) และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ($\tan \delta$) ของเซรามิก ZT ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ต่างๆ กันเทียบกับอุณหภูมิ	76
4.23	แสดงพฤติกรรมของค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (ϵ_r) และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ($\tan \delta$) เทียบกับอุณหภูมิ ที่ความถี่ 10 เมกกะเฮิรตซ์ ของเซรามิก ZT	78

- 4.24 แสดงพฤติกรรมของค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (ϵ_r) และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ($\tan \delta$) เทียบกับความถี่ ที่อุณหภูมิ 50 °ซ ของเซรามิก ZT ที่ผ่านการเผาขึ้นเตอร์ด้วยการใช้ระยะเวลาเผาเช่นานต่างกัน 78
- 4.25 แสดงพฤติกรรมของค่าตัวประกอบคุณภาพ (QF) เทียบกับความถี่ ที่อุณหภูมิ 50 °ซ ของเซรามิก ZT ที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ต่างๆ กัน 79

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University